



校正証明書

依頼者
住所
品名
型式又は性能
製造番号
製造者
校正項目
校正方法
環境条件
校正年月日

株式会社 渋谷光学
埼玉県和光市下新倉 3-22-2
対物ミクロメータ
OB2009
20130225
株式会社 渋谷光学
寸法
JQA 校正要領書による (文書番号 F314403)
温度 20℃±0.5℃, 湿度 55%±5%
2013 年 3 月 5 日

校正結果は次のとおりであることを証明します。

2013 年 3 月 6 日

東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号
一般財団法人 日本品質保証機構
計量計測センター

所長 中本文



校正結果 (標準温度 20℃)

目盛の長さ : 5 mm
目 量 : 0.01 mm

単位 : mm

目 盛	測定値	目 盛	測定値
0.5	0.4996	3.0	2.9994
1.0	0.9996	3.5	3.4993
1.5	1.4997	4.0	3.9992
2.0	1.9995	4.5	4.4991
2.5	2.4993	5.0	4.9991

校正の不確かさ

$$U = (1.0 + L/2000) \mu\text{m}$$

(ただし、 L は測定長 mm)

校正の不確かさは拡張不確かさであり、包含係数 $k=2$ で決定され、約 95% の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

使用した常用参照標準器等

(品名)	(製造者名)	(型式又は能力)	(識別番号)
波長安定化 He-Ne レーザ	HP	5518A	053-07-003

備考 1. 線膨張係数は $8.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ とした。
2. マーキング (黒) 側の目盛線を基点とした。

特記事項 なし

以 上

この証明書は、国内または海外の国家標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。日本品質保証機構 計量計測センターは、A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) によって ISO/IEC 17025-2005 に基づく校正機関として認定されています。

標準尺のトレーサビリティ体系

国家標準

産業技術総合研究所

JQA
計量計測センター

特定二次標準器

長さ用633 nmよう素分子吸収線波長安定化He-Neレーザー装置

633 nm実用波長安定化He-Neレーザー装置

依頼者
又は使用者

標準尺

1. JQA 日本品質保証機構
2. 校正に使用した標準器は、校正証明書に記載されております。

2026年3月9日

一般財団法人 日本品質保証機構
計量計測センター